eV-TEM: transmission electron microscopy with few-eV electrons

Geelen, D.

eV-TEM: Transmission Electron Microscopy with few-eV Electrons

PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van
de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van Rector Magnificus prof. mr. C.J.J.M. Stolker,
volgens besluit van het College voor Promoties
te verdedigen op donderdag 31 mei 2018
klokke 10:00 uur

door

Daniël Geelen

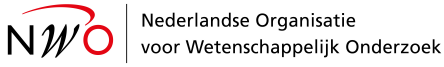
Geboren te Rotterdam, 21 Augustus 1988

Promotor:
Prof. dr. ir. R.M. Tromp

Co-promotor:
Dr. ir. S.J. van der Molen

Promotiecommisie:
Prof. dr. J.W.M. Frenken (ARCNL)
Dr. I. Müllerová (Czech Academy of Sciences, Praag, Tsjechië)
Prof. dr. E.R. Eliel
Prof. dr. A.J. Koster
Prof. dr. ir. T.H. Oosterkamp

Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma HTSM met project-nummer 12789 dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).



The cover of this thesis shows an artist impression of an eV-TEM micrograph of multilayer graphene. On the back an artist impression of the sample holder (left top) and the objective lens (right bottom) is shown.

Typesetting by B. C. van Zuiden using LaTeX.
An electronic version of this thesis can be found at https://openaccess.leidenuniv.nl

Casimir PhD Series, Leiden–Delft, 2018-13.
ISBN 978-90-8593-345-8

Voor Arthur, Liesbeth, en Alexander Geelen.

Contents